



INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

MOTOR TRANSPORT INSTITUTE

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

(+48 22) 811 32 31
 (+48 22) 811 09 06

e-mail: info@its.waw.pl
NIP: 525-00-08-382

www.its.waw.pl



AQAP 2110:2009
PN-EN ISO 9001:2009



AC 077



AK 012



AC 015



AB 089
AB 502
AB 503
AB 504

Warszawa dn. 2012-08-03
SZ-222-20/12/6/6/2012/.....

Szanowni Państwo,

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012

Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego mikroskopu sił magnetycznych z bipotencjostatem wraz z oprogramowaniem".

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, iż w dniu **2012-07-27** wpłynął od uczestnika postępowania wniosek o udzielenie wyjaśnień następującej treści:

„W związku z odpowiedziami udzielony przez Zamawiającego chcielibyśmy zadać kilka dodatkowych pytań, ponieważ udzielone wyjaśnienia nie były dla nas wystarczające, a w niektórych punktach są dla nas niezrozumiałe.

Z chęcią udzielimy szczegółowych wyjaśnień odnośnie każdego pytania, które zadajemy, czego niestety pisemnie zrobić się nie da. W każdej chwili możemy się pojawić u Zamawiającego i dokładnie wytłumaczyć o co pytamy i w jakim celu oraz jakie są różnice między tym co my chcemy zaoferować a tym co zostało opisane w specyfikacji.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę iż nasze pytania nie mają na celu jedynie umożliwienia nam złożenia oferty - chcielibyśmy także wskazać Zamawiającemu, które opisy w specyfikacji nie dotyczą konkretnych możliwości i funkcji urządzenia, a jedynie są nieistotnym szczegółem, który nie ma praktycznego zastosowania i tak naprawdę dotyczą gorszych odpowiedników prawdziwych funkcji (jak na przykład mikroskopia sił magnetycznych i nanoindentacja zastąpione są uproszczonymi trybami).

Nasze ostatnie pytanie dotyczy naszych wątpliwości dotyczących wartości opisanego urządzenia, które nie powinno przekroczyć ceny 800 tysięcy złotych netto. Nawet jeżeli Zamawiający preferuje to konkretne rozwiązanie, chcielibyśmy zwrócić uwagę na to iż nie powinno być ono zaoferowane za większą kwotę.

1. Dotyczy odpowiedzi z dnia 20 lipca na pytanie numer 3 (częstotliwość rezonansowa w trybie przerywanego kontaktu). Odpowiedź Zamawiającego wskazuje na tryb PeakForce oferowany przez firmę Bruker. Z informacji tej firmy wynika, że są oni w trakcie patentowania tego trybu. Nie jest nam znana żadna inna firma oferująca ten tryb.

Standardowy tryb z przerywanym kontaktem wymaga znalezienia częstotliwości rezonansowej, ale proces ten może się odbywać automatycznie, bez udziału użytkownika. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tradycyjnego trybu przerywanego kontaktu zamiast opisanego trybu, który może zaoferować tylko jedna firma?

2. Czy Zamawiający wymaga przedstawienia (lub posiadania) jakichkolwiek publikacji na temat badań magnetycznych w zewnętrznym polu magnetycznym na oferowanym urządzeniu, żeby wykazać, że taka możliwość istnieje i nie jest prototypem albo pojedynczym eksperymentem?

3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zewnętrznego urządzenia do wytwarzania pola magnetycznego?

Jeżeli tak, to czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie magnesu 1 mT?

Jeżeli nie, to w jaki sposób należy wykazać możliwość pracy w trybie MFM w zewnętrznym polu magnetycznym?

4. Do jakiego nanoindentera powinny pasować "dwie sondy przeznaczone do standardowego wykorzystywania podczas prowadzenia badań w trybie nanoindentacji"? Zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami wymagany jest jedynie tryb oparty na spektroskopii sił, a nanoindentacja nie jest wymagana. Zaoferowanie sond do nanoindentacji będzie oznaczało, że Zamawiający nie będzie mógł ich wykorzystać, ponieważ nie są one kompatybilne z żadnym mikroskopem sił atomowych.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymogu dotyczącego rozdzielczości optycznej na rzeczywisty wymóg podany w mikrometrach? Wymagana rozdzielczość 5 mega pikseli dotyczy tylko kamery rejestrującej obraz i nie ma wpływu na rzeczywistą rozdzielczość, która jest zależna od elementów optycznych takich jak obiektywy.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę, to czy wyraża zgodę na zaoferowanie układu o rozdzielczości 10 mega pikseli z obiektywem pozwalającym na uzyskanie rozdzielczości optycznej 10 mikrometrów?

6. Dotyczy odpowiedzi z dnia 20 lipca na pytanie numer 13. Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie układu obserwacji dźwigni pod kątem, pomimo iż w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie potwierdza, że układ taki powinien być prostopadły do próbki? Jeżeli Zamawiający uważa, że takie rozwiązanie jest lepsze, dlaczego nie jest ono wymagane? Najlepsze systemy SPM posiadają taki układ pionowo, prostopadle do próbki, tak więc wymóg taki eliminowałby tylko słabe rozwiązania, co do których Zamawiający przyznał rację, że są niewygodne i nieprecyzyjne.

7. Dotyczy odpowiedzi z dnia 20 lipca na pytanie numer 16. Jakiego rodzaju próbki ma na myśli Zamawiający? Mikroskopia sił magnetycznych jest techniką która przy dużej chropowatości nie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników. Z założenia, wszystkie techniki mikroskopii sił atomowych wymagają próbek o niedużej chropowatości, a pełen zakres skanowania wykorzystywany jest to zgrubnego określania pozycji skanowania wysokorozdzielczego.

Przyjętym standardem zakresu osi Z jest 10% wartości zakresu osi X. Czy Zamawiający mógłby przedstawić publikacje lub inne wyniki badań wykonanych za pomocą mikroskopii sił magnetycznych w zakresie 10 mikrometrów w osi Z, które chciałby wykonywać na opisywanym systemie, lub którymi się kierował opisując taki wymóg? Chcielibyśmy przeanalizować te badania, żeby móc zaproponować odpowiednie rozwiązanie.

8. Dla których trybów pracy systemu Zamawiający wymaga rozmiaru próbki o średnicy 200 mm, pozycjonowania w zakresie 175x150 mm oraz mocowania za pomocą podciśnienia? Czy jest to wymagane dla wszystkich trybów podstawowych opisanych w punkcie 1 (wymagane tryby pracy)?

9. Dotyczy odpowiedzi z dnia 26 lipca na pytanie numer 14. Czy to pytanie dotyczy pomiarów opisanych w punkcie 1.11? Czy oferowane urządzenie musi posiadać możliwość przeprowadzania testów zarysowania, pełzania oraz odporności na zużycie? Zamawiający napisał, że tego nie wymaga, ale jednocześnie napisał, że jest to

standardowy tryb tego urządzenia, przez co nie można stwierdzić czy jest to opcja, którą trzeba zaoferować czy nie.

10. Opisane przez Zamawiającego urządzenie jest praktycznie identyczne jak urządzenie opisane w specyfikacji przetargu na Uniwersytecie Jagiellońskim (CRZP/UJ/80/2012). Opisane przez Zamawiającego urządzenie posiada kilka opcji mniej i ma skróconą gwarancję, a w zamian ma kilka opcji więcej. Na podstawie tych różnic (oraz informacji na temat ich cen, które posiadamy) i wyniku wspomnianego przetargu (kwoty wybranej oferty) cena opisanego przez Zamawiającego urządzenia powinna wynosić poniżej 800 tysięcy złotych. Na jaką kwotę zostało oszacowane to urządzenie skoro rodzaj przetargu (powyżej progu 200 tysięcy euro) sugeruje większą kwotę? Ponieważ Zamawiający w odpowiedziach na pytanie potwierdził, że nie wymaga nanoindentacji, która jest bardzo drogą techniką, czy nie oznacza to że wartość zamówienia powinna być niższa a przetarg powinien być ogłoszony jako poniżej progu unijnego?

Czy Zamawiający podczas badania rynku i przygotowywania postępowania przetargowego składał takie samo zapytanie do różnych firm, czy też może przygotował postępowanie na podstawie jednej konkretnej oferty bez sprawdzania czy cena tej oferty nie została zawyżona? Zwracamy uwagę iż informacje na temat postępowań przetargowych są informacją publiczną, tak więc bez problemu można zapoznać się z ofertami różnych firm i cenami takich urządzeń. Informacje takie powinny być dla Zamawiającego bardzo istotne, ponieważ dysponując środkami publicznymi musi zadbać o ich jak najlepsze wykorzystanie, tak aby środki te nie były marnowane, w szczególności na zakup urządzenia po zawyżonej cenie”.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy.

- 1. Dotyczy odpowiedzi z dnia 20 lipca na pytanie numer 3 (częstotliwość rezonansowa w trybie przerywanego kontaktu). Odpowiedź Zamawiającego wskazuje na tryb PeakForce oferowany przez firmę Bruker. Z informacji tej firmy wynika, że są oni w trakcie patentowania tego trybu. Nie jest nam znana żadna inna firma oferująca ten tryb. Standardowy tryb z przerywanym kontaktem wymaga znalezienia częstotliwości rezonansowej, ale proces ten może się odbywać automatycznie, bez udziału użytkownika. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tradycyjnego trybu przerywanego kontaktu zamiast opisanego trybu, który może zaoferować tylko jedna firma?**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie tradycyjnego trybu z przerywanym kontaktem zamiast opisanego w punkcie 1.1 trybu pomiarowego. Zamawiający informuje również, że nie ma obowiązku dostosować wymagań technicznych do specyfikacji każdego z producentów aparatury, a jedynie do własnych potrzeb. Dodatkowo zgodnie z informacjami Zamawiającego przynajmniej dwie firmy posiadają obecnie wymagany w punkcie 1.1 tryb pomiarowy.

- 2. Czy Zamawiający wymaga przedstawienia (lub posiadania) jakichkolwiek publikacji na temat badań magnetycznych w zewnętrznym polu magnetycznym na oferowanym urządzeniu,**

żeby wykazać, że taka możliwość istnieje i nie jest prototypem albo pojedynczym eksperymentem?

Zamawiający nie widzi potrzeby, aby wymagać publikacji na etapie przetargu. Oczywiście dostawca może dołączyć odpowiednie publikacje do składnej oferty.

- 3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zewnętrznego urządzenia do wytwarzania pola magnetycznego? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie na zaoferowanie magnesu 1 mT? Jeżeli nie, to w jaki sposób należy wykazać możliwość pracy w trybie MFM w zewnętrznym polu magnetycznym?**

Zgodnie z Odpowiedziami z dnia 30 lipca 2012 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z mikroskopem sił magnetycznych urządzenia do wytwarzania pola magnetycznego wokół próbki. Może to być zewnętrzny elektromagnes lub układ oparty o magnesy stałe. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie jednego magnesu 1mT.

- 4. Do jakiego nanoindentera powinny pasować "dwie sondy przeznaczone do standardowego wykorzystywania podczas prowadzenia badań w trybie nanoindentacji"? Zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami wymagany jest jedynie tryb oparty na spektroskopii sił, a nanoindentacja nie jest wymagana. Zaoferowanie sond do nanoindentacji będzie oznaczało, że Zamawiający nie będzie mógł ich wykorzystywać, ponieważ nie są one kompatybilne z żadnym mikroskopem sił atomowych.**

W Odpowiedziach z dnia 26 lipca 2012 Zamawiający określił, iż razem z systemem mikroskopu MFM wymaga, aby dostarczone zostały dwie sondy AFM używane do przeprowadzania pomiarów w trybie nanoindentacji w mikroskopie sił atomowych. Sondy powinny posiadać sztywną dźwignię z przytwierdzoną na jej końcu piramidą diamentową o geometrii wgłębniaka Berkovicha (piramida trójścienna).

- 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymogu dotyczącego rozdzielczości optycznej na rzeczywisty wymóg podany w mikrometrach? Wymagana rozdzielczość 5 mega pikseli dotyczy tylko kamery rejestrującej obraz i nie ma wpływu na rzeczywistą rozdzielczość, która jest zależna od elementów optycznych takich jak obiektywy. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę, to czy wyraża zgodę na zaoferowanie układu o rozdzielczości 10 mega pikseli z obiektywem pozwalającym na uzyskanie rozdzielczości optycznej 10 mikrometrów?**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie układu o rozdzielczości 10 mega pikseli i rozdzielczości optycznej 10 µm.

6. **Dotyczy odpowiedzi z dnia 20 lipca na pytanie numer 13. Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie układu obserwacji dźwigni pod kątem, pomimo iż w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie potwierdza, że układ taki powinien być prostopadły do próbki? Jeżeli Zamawiający uważa, że takie rozwiązanie jest lepsze, dlaczego nie jest ono wymagane? Najlepsze systemy SPM posiadają taki układ pionowo, prostopadle do próbki, tak więc wymóg taki eliminowałby tylko słabe rozwiązania, co do których Zamawiający przyznał rację, że są niewygodne i nieprecyzyjne.**

Zamawiający udzielił już Odpowiedzi na to pytanie w dniu 20 lipca w punkcie numer 13.

7. **Dotyczy odpowiedzi z dnia 20 lipca na pytanie numer 16. Jakiego rodzaju próbki ma na myśli Zamawiający? Mikroskopia sił magnetycznych jest techniką która przy dużej chropowatości nie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników. Z założenia, wszystkie techniki mikroskopii sił atomowych wymagają próbek o niedużej chropowatości, a pełen zakres skanowania wykorzystywany jest to zgrubnego określania pozycji skanowania wysokorozdzielczego. Przyjętym standardem zakresu osi Z jest 10% wartości zakresu osi X. Czy Zamawiający mógłby przedstawić publikacje lub inne wyniki badań wykonanych za pomocą mikroskopii sił magnetycznych w zakresie 10 mikrometrów w osi Z, które chciałby wykonywać na opisywanym systemie, lub którymi się kierował opisując taki wymóg? Chcielibyśmy przeanalizować te badania, żeby móc zaproponować odpowiednie rozwiązanie.**

Zamawiający Odpowiedział już na to pytanie w dniu 20 lipca w punkcie numer 16.

8. **Dla których trybów pracy systemu Zamawiający wymaga rozmiaru próbki o średnicy 200 mm, pozycjonowania w zakresie 175x150 mm oraz mocowania za pomocą podciśnienia? Czy jest to wymagane dla wszystkich trybów podstawowych opisanych w punkcie 1 (wymagane tryby pracy)?**

Możliwość pracy z próbkami o średnicy 200mm i pozycjonowania w zakresie 175x150 wymagana jest dla trybów obrazowania powierzchni próbki opisanych w punktach – 1.1, 1.3-1.7, 1.9 – 1.12.

9. **Dotyczy odpowiedzi z dnia 26 lipca na pytanie numer 14. Czy to pytanie dotyczy pomiarów opisanych w punkcie 1.11? Czy oferowane urządzenie musi posiadać możliwość przeprowadzania testów zarysowania, pełzania oraz**

odporności na zużycie? Zamawiający napisał, że tego nie wymaga, ale jednocześnie napisał, że jest to standardowy tryb tego urządzenia, przez co nie można stwierdzić czy jest to opcja, którą trzeba zaoferować czy nie.

Wymagane pomiary zarysowania, odporności na zużycie i pełzania należą do standardowych możliwości badawczych nowoczesnych mikroskopów sił magnetycznych.

10. Opisane przez Zamawiającego urządzenie jest praktycznie identyczne jak urządzenie opisane w specyfikacji przetargu na Uniwersytecie Jagiellońskim (CRZP/UJ/80/2012). Opisane przez Zamawiającego urządzenie posiada kilka opcji mniej i ma skróconą gwarancję, a w zamian ma kilka opcji więcej. Na podstawie tych różnic (oraz informacji na temat ich cen, które posiadamy) i wyniku wspomnianego przetargu (kwoty wybranej oferty) cena opisanego przez Zamawiającego urządzenia powinna wynosić poniżej 800 tysięcy złotych. Na jaką kwotę zostało oszacowane to urządzenie skoro rodzaj przetargu (powyżej progu 200 tysięcy euro) sugeruje większą kwotę? Ponieważ Zamawiający w odpowiedziach na pytanie potwierdził, że nie wymaga nanoindentacji, która jest bardzo drogą techniką, czy nie oznacza to że wartość zamówienia powinna być niższa a przetarg powinien być ogłoszony jako poniżej progu unijnego? Czy Zamawiający podczas badania rynku i przygotowywania postępowania przetargowego składał takie samo zapytanie do różnych firm, czy też może przygotował postępowanie na podstawie jednej konkretnej oferty bez sprawdzania czy cena tej oferty nie została zawyżona? Zwracamy uwagę iż informacje na temat postępowań przetargowych są informacją publiczną, tak więc bez problemu można zapoznać się z ofertami różnych firm i cenami takich urządzeń. Informacje takie powinny być dla Zamawiającego bardzo istotne, ponieważ dysponując środkami publicznymi musi zadbać o ich jak najlepsze wykorzystanie, tak aby środki te nie były marnowane, w szczególności na zakup urządzenia po zawyżonej cenie”.

Zamawiający dokonał oceny oferty rynkowej i nie widzi potrzeby powrotu do tego etapu postępowania. Odniesienia natomiast do przetargu na Uniwersytecie Jagiellońskim są niezgodne ze stanem faktycznym.

Z poważaniem,

Zamawiający